

Proposta di Tesi Magistrale (ING-INF tutti gli indirizzi): Advanced Process Control per Semiconductor Manufacturing.

Keywords:

Computer Vision, Deep Learning, Fault Detection, Industry 4.0, Machine Learning, Optimization, Predictive Maintenance, Virtual Metrology.

Scopo della tesi:

La tesi ha come obiettivo lo sviluppo di tecnologie di Advanced Process Control, quali Fault Detection (su immagini e dati di sensoristica), Predictive Maintenance e Virtual Metrology, utilizzando tecniche di Machine Learning e Deep Learning.

Il progetto sarà sviluppato in collaborazione Infineon Monaco, una delle più importanti aziende mondiali di semiconduttori.

E' preferibile (ma non necessaria) una conoscenza pregressa di Python e dei framework di Deep Learning per alcuni dei temi sopraccitati.

Durata: 6 mesi circa

Per Informazioni:

Prof. Alessandro Beghi, beghi@dei.unipd.it

Dr. Gian Antonio Susto, gianantonio.susto@dei.unipd.it

<http://automatica.dei.unipd.it/people/gianantoniosusto.html>

